

Семинар по стендовым испытаниям в Москве, 22 марта 2018 г.

Компания National Instruments приглашает Вас принять участие в серии технических семинаров, посвященных применению технологий NI для построения автоматизированных систем тестирования, контрольно-поверочной аппаратуры, систем контроля и мониторинга.

Постоянное усложнение продукции современной промышленности выдвигает все более сложные требования к системам автоматизации измерений, от входного контроля компонентной базы и параметрического тестирования отдельных блоков до сложного функционального тестирования комплексных систем в условиях, максимально приближенным к реальным. С другой стороны, ставятся все более сжатые временные рамки, как для тестирования, так и для разработки систем тестирования.

Для решения этих задач сегодня необходимо использовать современные подходы, позволяющие не только создать систему, наилучшим образом решающую текущую задачу, но и готовую к обновлению и модификации по мере изменения продукции и требований.

В ходе семинаров специалисты National Instruments расскажут о лучших практиках построения систем тестирования и новинках программных и аппаратных средств, а партнеры и заказчики поделятся своим опытом реализации сложных комплексных проектов с помощью технологий и продуктов National Instruments.

Целевая аудитория

Семинары предназначены для инженеров и руководителей групп разработчиков, заинтересованных в применении современных технологий.

Узнайте о ключевых технологиях NI, о том, как Вы можете применять их в соответствии с конкретными потребностями Вашей задачи.

Не упустите шанс научиться у технологических лидеров, пообщаться с Вашими коллегами и узнать, как Вы можете оптимизировать задачи, которые важны для Вашей деятельности.

Компания National Instruments приглашает принять участие в семинаре по стендовым испытаниям в Москве, 22 марта 2018 г.

Семинар посвящен применению технологий NI для построения автоматизированных систем тестирования, контрольно-поверочной аппаратуры, систем контроля и мониторинга.

В программе семинара:

- Актуальные задачи автоматизированных систем измерения, управления и моделирования;
- Встраиваемые системы мониторинга и управления;

- Автоматизированные системы управления стендовыми испытаниями;
- Технологии быстрого прототипирования и программно-аппаратного моделирования (HIL).

Участие в семинаре бесплатное, по предварительной [регистрации](#).